PRORA®

Programmkomitee

B. Beckhoff, PTB, Berlin
S. Bjeoumikhova, Helmut Fischer GmbH, Standort Berlin
E. Gerndt, Bruker AXS SE, Karlsruhe
M. Haschke, Eggersdorf
A. Kharchenko, Malvern Panalytical B.V. Almelo, Niederlande
T. Krist, NOB, Berlin
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IAP e.V., Berlin
A. Mahlkow, OpTecBB e.V., Berlin
I. Mantouvalou, HZB BESSY II / TU Berlin
P. Oberta, Rigaku Innovative Technologies Europe s.r.o.
M. Ostermann, BAM, Berlin
S. Recknagel, BAM, Berlin
Ch. Seifert, IAP e.V. Berlin
F. Siewert, HZB BESSY II
H. Stiel, MBI, Berlin
U. Waldschläger, Bruker Nano GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP e.V., Berlin

Tagungsbeiträge

Sie haben die Möglichkeit, im Abstract-Book eine Anzeige zu schalten. Andere Unterstützung und Sponsoring sind gern willkommen. Sprechen Sie dazu mit unserem Organisationsteam.

Veranstalter

IAP – Institut für angewandte Photonik e.V., Berlin
BAM – Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin
Bruker Nano GmbH, Berlin
cosine GmbH, Berlin
Helmut Fischer Stiftung, Stuttgart
KETEK GmbH, München
OpTecBB – OpTec - Berlin-Brandenburg e.V.
PTB – Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
SPECTRO Analytical Instruments GmbH, Kleve
TU – Technische Universität Berlin
WISTA Management GmbH
Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH

Rahmenveranstaltung

Besonders hingewiesen wird auf das Satellite-Meeting des Berlin Laboratory for X-ray Technologies (BLiX) und das anschließende Stiftertreffen an der TU Berlin 25.11.2026

Preise

Kategorie	
Regulär	550,00 €
Studenten	30,00 €

Ausstellungs-fläche	240,00 €/m²


BAM Berlin

Organisation und Korrespondenzanschrift

Diana Matthies (Organisation)
Phone: +49 (0) 30 63 92-65 09

E-Mail:
prora2026@iap-adlershof.com

IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin

PRORA® ist eine eingetragene Marke des IAP e.V.

Anreise

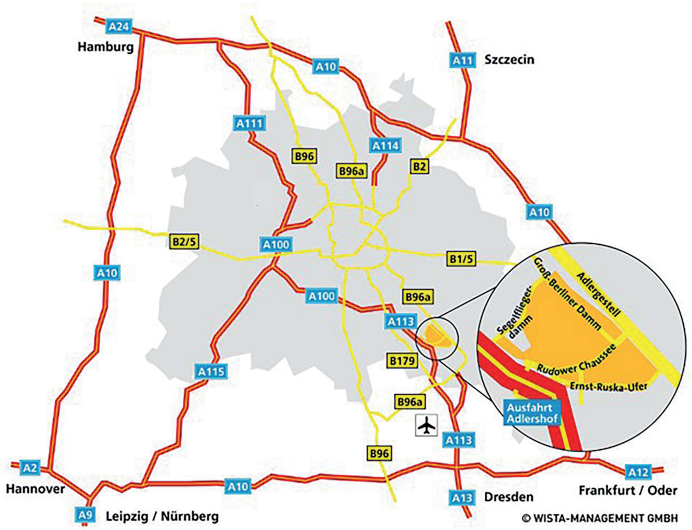


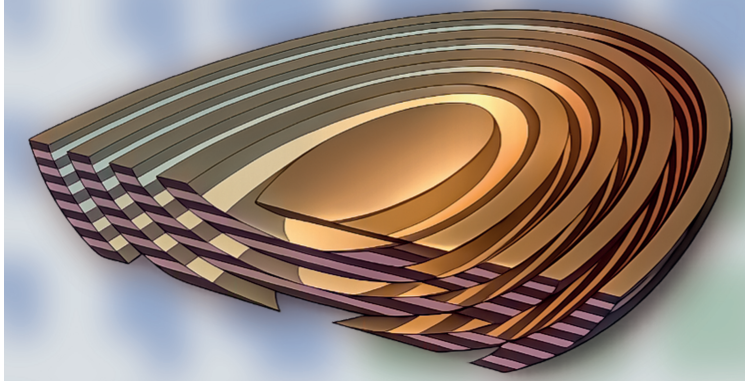
Abbildung Vorderseite:
Bragg-Fresnel-Optik

PRORA®

Programm

13. Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

26.–27. November 2026
Wissenschafts- und Technologiepark Berlin-Adlershof / Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Richard-Willstätter-Straße 11, 12489 Berlin



26

08.00 Registrierung der Teilnehmenden

09.20 **Eröffnung**
Carsten Engelhard (BAM)
Roland Sillmann (WISTA GmbH)
Christian Seifert (IAP e.V.)

METHODEN UND EXPERIMENTELLE ANSÄTZE DER PROZESSNAHEN RÖNTGENANALYTIK

Leitung: Christian Seifert

09.40 Methoden und Applikationen mit Röntgentomographie-Laborgeräten (E)
Diederik Ellerbroek (Bruker Nederland B.V.)

10.10 Röntgentopographische Untersuchungen mit laborbasierten Mikro-RFA-Geräten
Christian Hirschle (Bruker Nano GmbH)

10.30 Ultraschnelle Elektronenstrahl-Röntgentomografie für die Visualisierung hochdynamischer Strömungsprozesse in Industrie und Forschung
Frank Barthel (HZDR)

10.50 Konzepte und Applikationen für die Röntgenabsorptionsspektroskopie im Labor (E)
Sebastian Praetz (TU Berlin)

11.20 Table-Top NEXAFS-on-Surface: Technische Herausforderungen und Potential
Dong Du Mai (Institut für Nanophotonik Göttingen e.V.)

11.40 Mittagspause und Posterausstellung

12.40 X-ray Absorption Spectroscopy Implementation on a Laboratory X-ray Powder Diffractometer (E)
Detlef Beckers (Malvern Panalytical B.V.)

13.10 Surface-sensitive metrology on full-loop forksheet transistors with grazing exit X-ray fluorescence spectroscopy
Vinh-Binh Truong (PTB)

DATENANALYSE, AUSWERTUNG UND DIGITALE METHODEN

Leitung: Ioanna Mantouvalou

13.30 Maschinelles Lernen in der RFA-Spektrenauswertung: Möglichkeiten und Grenzen (E)
Jonas Baumann (Bruker Nano GmbH)

14.00 Reference-free nano-XRF analysis of TaOx memristive devices
André Wählisch (PTB)

14.20 Kaffeepause und Posterausstellung mit Bewertungen

14.40 Quantification of confocal micro-XRF elemental depth profiles of NMC Li-Ion batteries
Yannick Wagener (TU Berlin)

15.00 Highly Accurate Optical Constants of Tantalum in the 5–50 nm Spectral Range
Qais Saadeh (PTB)

15.20 Kaffeepause und Posterausstellung mit Bewertungen

15.40 **Firmenpräsentationen**
Leitung: Holger Stiel

16.40 **Postersession und Rundgang durch die Firmenausstellung**

18.00 **Get-together Speisemanufaktur**
Eröffnung durch Norbert Langhoff
Verleihung des Helmut-Fischer-Poster-Preises
durch Christian Wuttke
anschließend Fachvortrag
von Lothar Strüder (45 Min.)

Abendvortrag
Siliziumdriftdetektoren – Im Himmel und auf Erden (E)
Lothar Strüder (PNDetector GmbH)

27

ANWENDUNGEN IN INDUSTRIE, ENERGIE UND NACHHALTIGEN TECHNOLOGIEN

Leitung: Burkhard Beckhoff

08.30 Gerätetechnische Anforderung für die Leichtelementanalytik (E)
Michael Widera (SPECTRO Analytical Instruments GmbH)

08.45 Gerätetechnische Anforderung für die Leichtelementanalytik – Vom Messspektrum zum Ergebnis (E)
Dirk Wissmann (SPECTRO Analytical Instruments GmbH)

09.00 Detection and quantification of light and heavy elements in complex materials
Valentin Stoytschew (IAP e.V.)

09.20 Räumlich aufgelöste Lithiumdetektion an Graphitanoden mittels Soft X-Ray Emission Spectroscopy (SXES)
Svenja Kalthoff (Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme, Freiburg)

09.40 Materials and processes in aprotic batteries: from fundamental understanding to industrial recycling (E) -online-
Sergio Brutti (Sapienza Università di Roma, Italy)

10.10 Kaffeepause

10.30 RFA in der Batterie-Kreislaufwirtschaft: Prozessnahe Elementanalytik von Rohstoff bis Recycling
Adrian Fiege (Bruker AXS SE, Karlsruhe)

10.50 Advantages and Limitations of pXRF for the Elemental Analysis of Black Mass
Fatma Avci (BAM)

11.10 Resonance inelastic X-ray scattering for studying organo-sulfur cathode material
Hongfei Yang (PTB)

11.30 Mittagspause

INSTRUMENTIERUNG, INFRASTRUKTUR UND QUALITÄTSSICHERUNG

Leitung: Reiner Wedell

12.30 Größenfraktionierte Total-Reflektions-Röntgenfluoreszenzanalyse (TRFA) von Aerosolpartikeln nach direkter Abscheidung auf Probenträgern
Hagen Stosnach (Bruker Nano GmbH)

12.50 Direkte Detektion und photonzählende Pixelelektronik: Ein Vergleich von HPC-Flächendetektoren mit etablierten Detektortechnologien (E)
Marcus Müller (DECTRIS AG, Schweiz)

13.20 Towards traceable surface analysis for energy materials: from analytical procedures to battery-relevant measurands (E) -online-
Karin Kleiner (INRS – Institut National de la Recherche Scientifique, Québec, Canada)

13.50 Prospects and challenges for soft X-ray laboratory spectrometers as a routinely used analytical tool (E)
Richard Gnewkow (HZB)

14.20 Wideband multilayer coated grating for tender X-ray: From single-order theory to experimental demonstration
Shengyou Wen (Tongji University, China)

14.40 Kaffeepause

15.00 Low-energy x-ray to soft gamma-ray high-resolution Silicon Pore Optics
Boris Landgraf (cosine, The Netherlands)

15.20 Effizienzsteigerung in der Prozessüberwachung und industriellen Qualitätsprüfung durch referenzprobenfreie RFA mit moderner Labortechnik
Tobias Kiemle (Helmut Fischer GmbH, Sindelfingen)

15.40 A transfer system for inert sample transfer of sensitive materials
Philipp Hönicke (HZB)

16.00 Ende und Schlusswort durch Reiner Wedell